苹果静压接触应力分布特性的测量分析

冯哲,吴杰,孙慧杰,李凡

(石河子大学机械电气工程学院,教育部绿洲特色经济作物生产机械化工程研究中心,新疆石河子 832003) 摘要:为了了解不同成熟度苹果在不同曲率半径位置静压时的接触应力分布特性,本文采用 Prescale 感压胶片对苹果静压接触 应力分布进行了测量分析和 Hertz 公式理论计算,并探讨了 Hertz 公式关于接触应力面积计算的精度以及修正方法。研究结果表明, 苹果静压接触应力分布轮廓为近椭圆形,不同应力呈高低相间的不连续分布,低应力(≤0.2 MPa)主要在边缘分布,高应力(>0.5 MPa) 只有零星分布,可忽略不计。当压力 100N 以上时,两种成熟度苹果的应力面积有显著性差异。随着曲率半径增大,相同压力水平下 苹果的应力面积因成熟度不同而表现出不同程度的增大趋势。接触应力面积的 Hertz 公式计算值与感压胶片测量值存在不同程度偏差, 当引入 λ=1.5780-0.0042F 修正 Hertz 公式的等效弹性模量 E^{*},可明显提高苹果静压接触应力面积的理论计算精度。

关键词:静压;接触应力分布;成熟度;曲率半径;Hertz公式

文章篇号: 1673-9078(2014)6-76-81

Measurement Analysis of Contact Pressure Distribution of Apple under

Compression

FENG Zhe, WU Jie, SUN Hui-jie, LI Fan

(Research Center of Oasis Agricultural Mechanization, Ministry of Education, College of Mechanical and Electrical Engineering, Shihezi University, Shihezi 832003, China)

Abstract: In this study, the pressure distribution of apple subjected to static loading was measured by the pressure sensitive film technique. The effects of apple maturity and curvature radius at contact location of fruit on pressure area were focused on. The results were calculated by Hertz equation; meanwhile, the calculation accuracy of the equation on contact pressure area was analyzed. The result showed that the contour of pressure distribution was near elliptical, and the discontinuous distributed pressures had the variation feature of rising and falling. The pessure less than 0.2 MPa occupied at the edge of the contact region, while the area of pressure over 0.5 MPa distributed at tiny spots. When the apple was loaded over 100 N, the pressure areas of two different maturity apples showed significant difference. With the increase of curvature radius, the pressure areas of apple at same load increased to varied extent due to maturity difference. Compared with film measurements of apple pressure area, the calculations with Hertz equation showed larger deviation. Hence, a correction coefficient (λ =1.5780 -0.0042*F*) was introduced to modify the equivalent elastic modulus in the Hertz equation. As a result, there was a good agreement between the measured contact areas and the predications using the modified Hertz equation. This indicated that the modified Hertz equation could precisely estimate pressure area of apple under static load.

Key words: compression; contact pressure distribution; ripeness; radius of curvature; Hertz equation

我国是世界苹果生产第一大国^[1],据联合国粮食 及农业组织统计,2010年全世界的苹果产量为6951.20 万t,我国为3326.52万t,占世界总产量的47.86%。 然而苹果成熟后在包装、分级和运输等机械化作业环 节中,不可避免的发生机械损伤而变质腐烂,每年的 收稿日期:2014-01-02

基金项目:国家自然科学基金资助项目(31160335)

作者简介:冯哲(1989-),男,在读硕士生,主要从事农产品品质安全及检 测研究

通讯作者:吴杰(1972-),男,博士,教授,主要从事农产品品质安全及检 测研究 果品损耗率达到 30%以上,其中静压损伤较为普遍^[2]; 同时,在果蔬机械化采摘过程中,当夹持机构对果实 施加的载荷超过果肉组织的损伤阈限时,果蔬也会发 生静压损伤^[3]。由于苹果损伤面积已成为评估果实损 伤程度和外观品质分级的重要依据^[4],而损伤面积又 与果实受载的应力分布有直接关系,因此,研究苹果 静压接触应力分布特性,对苹果果实机械防损、品质 保持及苹果机械作业的减损结构优化设计具有实践指 导价值。

早期,果品受载时的接触应力分布采用Hertz公式 进行理论计算。由于Hertz公式是以弹性理论为基础, 因此对于具有复杂几何特征和粘弹特性的果实类材料 是否适用是需要研究探讨的。最近,随着感压胶片测 量技术的出现,吴杰及Lu等^{15~61}都采用Prescale感压胶片 测量方法进行了梨果接触应力分布特性分析,以揭示 梨果的损伤机理,为减少梨果机械损伤提供了研究基 础。

许多研究表明,果实的损伤面积受其成熟度及接触位置的曲率半径影响显著^[7~8]。因此,研究苹果的成 熟度和受载位置的曲率半径对其接触应力分布特性的 影响,有助于更准确地了解苹果受载机械损伤规律。 为此,本研究采用感压胶片对不同成熟度苹果在不同 曲率半径位置静压时的接触应力分布特性进行测量分 析;同时将测试结果与 Hertz 公式的计算结果进行比 较,以探索苹果损伤面积的准确估测方法。

1 材料与方法

1.1 材料

试样为红富士苹果,采自新疆阿克苏红旗坡农场 同一果园,采样期在2012年10月4日,人工采摘, 剔除有病虫害、雹伤的苹果及畸形果,质量为 (238±10.11)g。采后将果样冷藏,冷藏温度为 (2±1)℃,相对湿度(90±5)%。

1.2 主要仪器设备

LLLW型 Prescale 感压胶片与配套的 FPD-8010E 压力图像数字化分析系统,日本 Fuji 公司; PrefectionTMV300Photo型专用扫描仪,日本 Epson 公司;GY4型数显果实硬度计,美国艾伯仪器公司; 数显曲率半径仪,桂林市晶瑞电子有限责任公司。

1.3 试验方法





究采用水果硬度计测量苹果的带皮硬度,测头直径 11.1 mm,以25.4 mm/min 恒定速率在果实赤道部穿刺 至深度 7.94 mm 后取值^[9]。如图 1 所示,每隔 3 d 测 量一次苹果常温贮藏硬度,苹果硬度在第 39 d 后下降 趋势趋于平缓。因此,根据国家标准对果实成熟度的 规定^[4],本试验选择 2 种成熟度试样:坚熟苹果和后 熟苹果(储藏期 45 d),其物性参数见表 1。

表 1 苹果试样的基本物性参数

Table 1 Physical properties of Aksu apple sample

| 试样 | 带皮硬度 /N | 可溶固形 物/°Brix | 含水率(湿基) /% |
|----------|------------|-----------------|---------------------------|
| 坚熟 | 79.91±2.62 | 13.74±0.43 | 86.84±1.20 |
| 后熟(45 d) | 56.00±2.58 | 12.60±0.15 | 84.5 <mark>8</mark> ±0.60 |

1.3.2 苹果静压接触应力分布的测量

将苹果试样放置在两平行刚板间进行静压试验, 平板与苹果赤道部接触。对于冷藏苹果,试验前室温 放置 24 h。已有研究表明,红富士苹果果肉屈服应力 临界值在 40~100 N范围^[10]且其静载压缩所能承受的 最大压力为 250 N^[11],但预备试验中 45 d 后熟的苹果 在 250 N静压时已出现破裂,因此本研究选取压力水 平为 40、60、80、100、150、200 N。压缩时,将感 压胶片固定于平板与苹果的接触表面,保压时间 300 s。感压胶片的测量原理参考文献^[5]。静压试验后将感 压胶片采用扫描仪和颜色校正板读取接触应力分布的 特征图,然后经过压力图像数字化分析系统进行数值 解析以及平滑处理,获得静压接触应力分布面积及应 力分布图像的平滑处理图(图 2)。每个水平试验重复 10 次。



图 2 苹果静压接触应力分布图的处理

Fig.2 Mapping of contact pressure distribution for apple under

compression

1.3.3 苹果接触位置曲率半径的测量

参考文献^{III}的方法,采用曲率半径仪测量苹果曲 率半径。如图 3 所示,分别测量接触位置赤道方向横、 纵坐标的曲率半径 R_x和 R_y,然后取调和平均值 2R_xR_y/(R_x+R_y)作为接触位置的曲率半径 R。根据图 4 所示苹果赤道部的曲率分布,本研究取平板压缩的接 触位置曲率半径为:(25±1.26)mm、(35±1.60)mm、 (45±1.51)mm。试验前,首先选择并确定平板与苹 果接触点的所需曲率半径并标记,然后进行平板压缩 试验。

(1)

(2)



图 3 苹果曲率半径测量图







根据 Hertz 接触理论,苹果平板压缩的接触应力 面积由下列公式计算^[12]:

$$A = \pi (\frac{3FR}{4E})^{2/3}$$

注: A 为接触面积, mm²; F 为静压载荷, N; R 为接触 位置的曲率半径, mm; E^{*}为等效弹性模量, 可由下式计算:

$$(\frac{1-v_1^2}{E_1}+\frac{1-v_2^2}{E_2})$$

2 结果与讨论

2.1 苹果静压接触应力分布特性

以压力200N和接触位置曲率半径35mm时的苹 果静压为例,由图5所示的接触应力分布特征可看出, 不同成熟度苹果的应力分布轮廓为近椭圆形,不同应 力呈高低相间的不连续分布,这反映了苹果表面细观 上的凸凹不平程度。≤0.2 MPa的低应力主要分布在边 缘;高应力(>0.5 MPa)并未集中在接触区域中心位 置。苹果在较低成熟度时,低应力(≤0.2 MPa)分布 面积很小,但在较高成熟度时却有明显增大。







Fig.6 Relationship between contact pressure area and the

curvature radius of apple

注: a 坚熟苹果, b 后熟苹果。

图 6 表明,随着压力增大,应力面积明显增大。 在相同压力水平下,应力面积随曲率半径的增大呈不 同程度的增大趋势。对于较低成熟度苹果,压力为 40、 60、80 N时,苹果较大的曲率半径差异对应力面积影 响较为显著(P=0.028),但当压力增大到 100 N 以上 时,曲率半径对应力面积影响不显著(P=0.245)。原 因可能是,硬而脆的苹果在较小压力作用下主要表现 为弹性变形,应力面积对接触点曲率半径变化有较敏 感响应;当苹果变形开始以不可恢复的塑性变形为主 导时,压力的增大是造成接触应力面积显著变化的主因,而接触位置曲率半径差异不再会起太大影响作用。 与之相比,成熟度较高的苹果由于果肉粘性增强,发 生了较严重的塑性变形,因此总体而言,受压时接触 应力面积受苹果曲率半径影响不显著,尤其是在较小 压力时几乎无变化。



注: a: R25, b: R35, c: R45。

从图 7 可以看出,当压力为 40、60、80 N 时,成 熟 度 的 差 异 对 静 压 接 触 应 力 面 积 影 响 不 显 著 (P=0.155);而当压力增大到 100 N 以上时,成熟度 差异才对应力面积有显著性影响(P=0.033)。这是因 为在较小压力作用时,不同成熟度的苹果发生的变形 都以可恢复的弹性变形为主,而在 100 N 以上的较大 压力下,苹果果肉可能发生严重的塑性变形,苹果成 熟度差异使果肉的屈服极限明显不同,这导致苹果有 不同程度的塑性变形,从而造成接触应力面积出现显 著差异。

2.2 静压接触应力理论值与测量值的对比分

析

从图 8 可看出,不同成熟度苹果的接触应力感压 胶片测量值与 Hertz 公式计算值都存在不同程度的偏 差。通常,苹果在较高接触曲率半径位置以较低的压 力压缩时,接触应力的测量值较为接近 Hertz 公式计 算值,但当压力过大时,接触应力测量值开始高于计 算值,并朝着偏离 Hertz 曲线方向发展。从图中可以 看出,当苹果在曲率半径 R25 mm 位置受压时,压力 一旦超过100N以后,应力面积的测量值与计算值的 偏差开始明显增大。这是因为 Hertz 公式是基于弹性 假设,只有在苹果以弹性变形为主时,接触应力的理 论计算误差才会较低。当接触点曲率半径较小时,苹 果抗变形能力偏低,因而在较大压力时就会发生严重 的塑性变形,使得接触应力面积的 Hertz 公式计算值 与测量值存在较大偏差。这也进一步表明,需要对 Hertz 公式进行修正,才能保证苹果在发生较大塑性变 形的受压条件下仍能满足计算精度要求。





A

A



图 8 苹果静压接触应力面积的理论值与测量值比较

Fig.8 Comparison between film measurements and Hertz

equation calculations for the contact pressure area

注: a: R25, b: R35, c: R45 (坚熟苹果); d: R25, e: R35, f: R45 (后熟苹果)。

根据文献^[14]可知,当材料进入塑性变形阶段时, 等效弹性模量 E^{*}不再是常数,而与当时的压力水平有 关。因此,可将其中的 E^{*}修正为 E_D,其中 E_D∈F,即:

$$\mathbf{A} = \pi \left(\frac{3FR}{4E_{\rm D}}\right)^{2/3} \tag{3}$$

$$\mathbf{E}_{\mathbf{p}} = \lambda \mathbf{E}^* \tag{4}$$

$$\lambda = k_0 + k_1 F + k_2 F^2 + k_3 F^3 + \dots + k_n F^n$$
(5)

注: k₀, k₁, k₂, ..., k_n为待拟合的系数 将公式 (3)、(4) 和 (5) 合并, 即为:

$$A = \pi (\frac{3FR}{4E^*})^{2/3} (\frac{1}{\lambda})^{2/3}$$
 (6)

 $q=A'A=(\frac{1}{\lambda})^{-2/3}$ 作为修正指标,将q与F进行 回归分析,通过多项式拟合统计得出 λ 的关系式,确 定未知数 k_0 , k_1 , k_2 ,..., k_n 的值,最终确定 λ 参数 值。

尽管成熟度的提高也对接触面积有不同程度影响,但通过计算可知,两种成熟度苹果的 ko 和 k1 分别 都接近 1.5780 和 0.0042, k2~kn 的各值都很小 (<2.932E-5),可 忽略不计。因此,确定 λ=1.5780-0.0042F(R²=0.98)作为通式。从修正的 Hertz 公式计算曲线可以看出(图8),它与感压胶片测量值 相差很小,这表明修正的 Hertz 公式计算可以提高苹 果静压接触应力面积的理论估测。

3 结论

3.1 苹果静压接触应力分布轮廓为近椭圆形,应力呈高低相间的不连续分布,低应力(≤0.2 MPa)主要分布在区域边缘且面积较小,但随着成熟度提高逐渐增大;高应力(>0.5 MPa)分布很小,可忽略不计。
3.2 在相同压力水平下,应力面积随曲率半径增大呈增大趋势。对于较低成熟度苹果,应力面积只在40、60、80 N压力时受曲率半径影响显著;对于较高成熟度苹果,应力面积总体受曲率半径影响不显著。此外,只有在压力100 N以上时,苹果成熟度差异才对应力面积有显著性影响。

3.3 接触应力面积的 Hertz 公式计算值与感压胶片测 量值存在不同程度偏差,通过引入 λ=1.5780-0.0042F 修正 Hertz 公式的等效弹性模量 E^{*},可明显提高苹果 静压接触应力面积的理论计算精度。

参考文献

[1] 芮汉明,钱庆银,张立彦.微波加热对苹果罐头品质的影响[J].现代食品科技,2013,29(7):1645-1650

RUI Han-ming, QIANG Qing-yin, ZHANG Li-yan. Effect of microwave heating on the quality of canned apple [J].

Modern Food Science and Technology

Modern Food Science and Technology, 2013, 29(7): 1645-1650

[2] 冯能莲,单明彻.苹果静重损伤的试验研究[J].农业机械学 报,1996,27(3):71-75

FENG Neng-lian, SHAN Ming-che. Test study of apple bruise under static load [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 1996, 27(3): 71-75.

- [3] Zhao De-an, Lv Jidong, Ji Wei. Design and control of an apple harvesting robot [J]. Biosystems Engineering, 2011, 110:112-122
- [4] GB/T 10651-1989,鲜苹果[S]
- [5] 吴杰,郭康权,葛云,等.香梨果实跌落碰撞时的接触应力分 布特性[J].农业工程学报,2012,28(1):250-254
 WU Jie, GUO Kang-quan, GE Yun, et al. Contact pressure distribution characteristics of korla pear fruit at moment of drop impact [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Engineering (Transaction of CSAE), 2012, 28(1): 250-254
- [6] Lu F, Ishikawa Y, Kitazawa H, et al. Measurement of impact pressure and bruising of apple fruit using pressure-sensitive film technique [J]. Journal of Food Engineering, 2010, 96(4): 614-620
- [7] Zarifneshat S, Ghassemzadeh H R, Sadeghi M, et al. Effect of impact level and fruit properties on golden delicious apple bruising [J]. Am. J. Agri. & Biol. Sci., 2010, 5(2): 114-121

- [8] Schmitz-Eiberger M, Matthes A. Effect of harvest maturity, duration of storage and shelf life of apples on the allergen Mal d 1, polyphenoloxidase activity and polyphenol content [J]. Food Chemistry, 2011, 127: 1459-1464
- [9] Abbott J A, Watada A E, Massie D R. Effe-gi, Magness-taylor, and instron fruit pressure testing devices for apples, peaches, and nectarines [J]. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 1976, 101(6): 698-700
- [10] Lewis R, Yoxall A, Marshall M B, et al. Characterising pressure and bruising in apple fruit [J]. Wear, 2008, 264: 37-46
- [11] Herold B, Geyer M, Studman Clifford J. Fruit contact pressure distributions-equipment [J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2001, 32: 167-179
- [12] Johnson KL.接触力学[M].北京:高等教育出版社,1992
- [13] Kim G W, Kim M S, Sagara Y, et al. Determination of the viscoelastic properties of apple flesh under quasi-static compression based on finite element method optimization [J].
 Food Sci. Technol. Res., 2008, 14(3): 221-231
- [14] 姜晋庆,竺润祥,尚世英.弹塑性接触问题的分析方法[J].光 学机械,1981,6:55-64
 - JIANG Jin-qing, ZHU Rui-xiang, SHANG Shi-ying. Analysis of elastic-plastic contact [J]. Optics and Precision Engineering, 1981, 6: 55-64